

光束质量分析仪和大功率光束分析

大功率光束分析



Beam Analyzer HP

高达 5 千瓦的大功率测量，基于光束采样器技术，结合压缩空气冷却，可实时测量光束轮廓和相对功率波动。



BeamOn U3 HP

全功率测量系统，基于高分辨率相机，结合我们获得专利的采样和冷却技术，可测量长达 1.6 微米的红外波长。



BeamOn HP

光束分析的简化版（与 BeamOn U3 相比），性价比极高。



Microbeam HP

独一无二的微光束分析仪，适用于最小 5 微米以下、功率级超过 100 瓦的较小聚焦光束。



LAM Beam Analyzer

这款新仪器专为激光增材制造（简称 LAM）而设计。测量关键参数如光束大小、精确光束位置和功率。

- 完善的产品系列，用于检测材料加工中所用的大功率激光光束。
- 光束分析仪 HP 探测器系列在线测量光束轮廓和绝对功率。
- 在激光打印技术中测量 M^2 和束腰的精确位置。
- 测量 5 微米至 9 毫米的大功率光束。

光束分析仪系列



BeamOn WSR

以专利技术为基础，结合相机技术，可测量从紫外到 1550 nm 的光束。全套附件（含内置电动滤光片转轮）均有销售。



BeamOn LA

光束诊断测量系统，用于实时测量连续或脉冲式大型激光光束（达 45 毫米）。



uBeam

光束诊断测量系统，用于实时测量和显示亚微米范围的连续或脉冲激光、光纤以及激光二极管的光束轮廓。



BeamOn U3

2.35 百万像素宽光谱探测器，可测量长达 1.6 微米的光束，附件齐全，适合多种用途。

- 完整系列的光束质量分析仪提供诸如刀口扫描和层析光束重建等技术，结合前所未有的宽光谱范围，单个探测器即可探测 200 - 1600 nm 甚至到 2700 nm 的光束。
- 0.5 微米以下到 45 毫米光束均可探测，配备全套附件（未显示），可用于 M^2 测量及其他尖端用途。



DUMA OPTRONICS LTD.

网站: <http://www.dumaoptronics.com>

电话: 972-4-8200577 传真: 972-4-8204190

电子邮件: sales@duma.co.il



光束定位和校准

系列



SpotOn Analog
完备的解决方案，用于快速而精准地定位光束。此系统既可测量光束位置，又可测量功率。



SpotOn Mobile
高精度紧凑型光束定位系统，附有 Nexus7 PC Tablet。



LaserOn
结构紧凑的可见光激光二极管 (635 nm)，内置用于光束方向微调的螺丝。辅助定位应用。



SpotOn LA
超过 100 mm 的大孔径光束定位。



SpotOn USB 2.0
便携式、快速准确的光束（小到 0.1 微米）定位系统，带 USB2.0 接口。

- 全系列光束定位系统，包括各种探测器类型，例如：
横向效应探测器、中心开孔型四象限探测器、 $4 \times 4 \text{ mm}$ 至 100 mm 尺寸探测器以及 CCD 探测器。
- 多个探测器同时工作。
- 快速采集，高达 60 kHz 。
- 校准后的激光可用作自准直参考轴。

自准直系列



Laser Analyzing Autocollimator
电子自准直仪和激光光束分析相结合。



Autocollimator HR
高精度大孔径自准直仪，分辨率高达 0.01 秒。



AlignMeter
独一无二的仪器，同时测量入射激光的姿态和位置。



Laser Analyzing Telescope
光束特性分析用望远镜，用于姿态测量及自准直度测量，分辨率高达 1 微弧度。



AngleMeter
极大角度入射激光的姿态测量。

- 提供全线自准直产品，将自准直原理和激光自准直相结合，角度测量精度极高，同时以微弧度级分辨率提供多瞄准线互相对准的功能。
- 此外还提供光束发散角和姿态特性分析。
- 独一无二的红外（长达 1550 nm ）自准直仪和激光分析望远镜将在业界掀起一场革命。



DUMA Optronics LTD.

网站: <http://www.dumaoptronics.com>

电话: 972-4-8200577 传真: 972-4-8204190
电子邮件: sales@duma.co.il

